# CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>:Eu的真空紫外光谱特性

周 丹,何大伟\*,侯 涛

北京交通大学光电子技术研究所,发光与光信息技术教育部重点实验室,北京100044

**摘 要** 采用高温固相反应利用原料 CaCO<sub>3</sub>, MgO, SiO<sub>2</sub>和 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>合成了 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>样品,并研究 了其结构特性、光谱特性。CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>属于单科晶系,基质掺入 Eu 离子后结构没有明显变化。 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>在 147 nm 真空紫外光激发下呈红色发射,发射主峰位于 611 nm,是 Eu<sup>3+</sup>的<sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub> 跃 迁的典型发射。当 Eu<sup>3+</sup>的相对摩尔浓度在 0.02 到 0.10 mol 之间变化时,由相关数据可以发现有浓度猝灭 现象发生。CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup>在 172 nm 真空紫外光激发下呈蓝色发射,发射主峰位于 452 nm,是 Eu<sup>2+</sup>的 5d→4f 跃迁的典型发射。添加不同浓度的 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 后可大大提高样品的发光强度。

关键词 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu; 等离子显示屏; 真空紫外 中图分类号: O614.3 文献标识码: A 文章编号: 1000-0593(2007)05-0978-04

# 引 言

为了获得高清晰度大屏幕等离子平板显示器,除了驱动 电路以外,最重要的是发光材料,即性能比较好的荧光粉。 而荧光粉的发光就是依靠在电压的作用下变为等离子状态的 惰性气体的激发而来的。在 PDP 中惰性气体的发射波长位 于真空紫外,其主要的发射波长为130,147 和172 nm<sup>[1]</sup>。众 所周知, Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Mn<sup>2+</sup>作为绿色荧光粉在真空紫外的激发 下有很好的发光效率的稳定性。基于这一性质,我们选择了 以硅酸盐为基质的荧光粉进行研究,在此文中我们合成了发 红光的 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>和发蓝光的 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup>荧 光粉,并对样品的真空紫外区激发光谱及相应的发射光谱进 行了探讨。

### 2 实 验

采用高温固相反应法制备样品。按一定的摩尔比称取相 应量的 CaCO<sub>3</sub>(A. R.), MgO(A. R.), SiO<sub>2</sub>(A. R.), Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (99.99%), H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>(A. R.)。在玛瑙研钵中充分混合研磨后 放入刚玉坩埚,在碳还原气氛下于1250℃烧结3h,冷却至 室温后,研细即得样品。样品的结构采用日本理光 Dmax-RB 型转阳极 X 射线衍射仪检测。样品 VUV 激发光谱和真空紫 外激发下发射光谱,是在北京交通大学光电子技术研究所的 真空紫外光谱仪上进行检测,所有样品均在室温下进行检 测,其中激发光谱由水杨酸钠校正。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 X射线分析

CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>的粉末 X 射线衍射谱及结构图<sup>[2]</sup>如图 1 所示,由图 1 可见,其数据与 JSPDS 标准卡符合得较好。同时, 基质掺入激活离子后结构没有明显变化,这表明在该实验条 件下,可以合成晶体结构为单斜晶系的硅酸钙镁石结构。依 据泡利定则,因为 Eu 离子和 Ca 离子的半径比较接近,所以 Eu 离子进入晶格只是取代了基质中 Ca 的晶格位置,而不是 Mg 的晶格位置。

#### 2.2 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 真空紫外激发光谱

图 2 是监测 611 nm 时 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>的真空紫外激 发谱,可以看到这个激发谱包括 3 个宽的谱带,峰值分别位 于 130,168 和 217 nm。2 个谱带峰值分别位于 130 和 168 nm,这是基质吸收带<sup>[3]</sup>。这 2 个谱带强度相对比较强。另外 一个峰值位于 217 nm 的吸收带是电荷迁移吸收带,这个吸 收带是由于 Eu<sup>3+</sup>与近邻的 O<sup>2-</sup>发生电荷迁移而产生的<sup>[4]</sup>。

### 2.3 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 真空紫外发射光谱

图 3 是在 147 nm 真空紫外激发下 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : xEu<sup>3+</sup> (x=0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10)的发射光谱。从图中可 以看到 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : xEu<sup>3+</sup>的发射谱中包括峰值位于 596, 611, 655 和 700 nm 的 4 个发射带,分别对应于 Eu<sup>3+</sup>的<sup>5</sup>D<sub>0</sub>  $\rightarrow$ <sup>7</sup> $F_1$ , <sup>5</sup> $D_0$  $\rightarrow$ <sup>7</sup> $F_2$ , <sup>5</sup> $D_0$  $\rightarrow$ <sup>7</sup> $F_3$  和<sup>5</sup> $D_0$  $\rightarrow$ <sup>7</sup> $F_4$  跃迁发射,其中峰

收稿日期: 2006-01-23, 修订日期: 2006-05-08

**基金项目:**国家自然科学基金项目(10644002),北京市自然科学基金项目(2052019)和北京市科学技术委员会项目(Y040600104711)资助 作者简介:周 丹,女,1980年生,北京交通大学光电子技术研究所硕士研究生 \*通讯联系人 e-mail: dwhe@center. njtu. edu. cn

值位于 611 nm 的发射峰最强, 这说明 Eu<sup>3+</sup>占据了非反演对 称中心。 $Eu^{3+}$ 的基态为<sup>7</sup> $F_0$ ,激发态为<sup>5</sup> $D_0$ ,<sup>5</sup> $D_1$ , 由<sup>5</sup> $D_0$ 和  ${}^{5}D_{1}$  跃迁到 ${}^{7}F_{I}(J=O\sim5)$ 发出各种波长的光,这种跃迁为 f-f 跃迁, 受晶体场影响较小, 发射光谱为线状光谱, 发射 颜色与 Eu<sup>3+</sup>在晶格中所处的位置有关。如果稀土离子占据 的晶格位不具有反演对称性,奇数的晶场分量可以使相反宇 称态混入 4 f" 构型能级中, 这时候电偶极跃迁不再严格禁 止,并且那些  $\Delta J = 0$ ,  $\pm 2$  的跃迁对于这个变化是很敏感的, 产生的跃迁叫做超敏感跃迁<sup>[5-7]</sup>。若 Eu<sup>3+</sup>占据对称中心位 置,则在橙区<sup>5</sup> $D_0 \sim {}^7F_1$ (大约相当于 593 nm)产生发射。若  $Eu^{3+}$ 未占据对称中心位置,则在红区<sup>5</sup> $D_0 \sim {}^7F_2$ (大约相当于 618 nm 和红外区<sup>5</sup> $D_0 \sim F_4$ )产生发射。因为一个稀土离子占 据的晶格位具有反演对称性,在4f<sup>n</sup>构型内能级间作为电偶 极跃迁的光谱跃迁是严格禁止的,它们只能产生遵从 $\Delta J =$ 0, ±1 这个选择定则的磁偶极跃迁, 或者产生振动电偶极跃 迁。



Fig. 1 X-ray diffraction pattern and structure of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> phosphor

(a): Diffraction pattern; (b): Structure of sample

从图 3 中可以看出, CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>:  $xEu^{3+}$  荧光粉的发光 强度随 x 的变化而变化,在 x=0.08 时发光强度达到最大 值,这时荧光粉的发光性质最佳。当 Eu<sup>3+</sup> 的摩尔浓度增大 时,荧光粉的发光强度应该随着发光中心的增多而增加,但 事实上不是这样的。因为能量在一个一个 Eu<sup>3+</sup>之间传递, 如 果 Eu<sup>3+</sup>的摩尔浓度很高,它不仅不会对荧光粉的发光强度 带来增强,反而减弱了发光强度。这是因为在高激活剂摩尔 浓度时,能量在 Eu<sup>3+</sup>之间传递很可能最后被晶格中某些陷 阱所俘获,造成发光的浓度猝灭。



VUV excitation spectrum of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>3+</sup> Fig. 2



Fig. 3 VUV emission spectra of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : xEu<sup>3+</sup>

# $a_1 = 0.02; b_1 = 0.04; c_1 = 0.06; d_1 = 0.08; e_1 = 0.10$

#### 2.4 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 加入对 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 发光性能的影响

表1为添加不同浓度 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 后所得样品的发射峰相对 强度,可以看出作为助熔剂的 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 的加入大大提高了样 品的发光强度。当H3BO3的浓度过高时,样品的发光强度反 而会下降,由此确定了 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 的最佳浓度是 0.06 mol•  $mol^{-1}$ ,同时发现 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 的浓度于 0.1 mol·mol<sup>-1</sup>时,样品 很难粉碎同时制备温度变化很大,反而不利于样品的合成。 在高温固相反应中,H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>助熔剂的加入可更好地促进激 活剂进入晶体形成发光中心,从而提高发光材料的发光强 度。

#### Relative intensity (611 nm) of the samples with Table 1 various H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> concentration

H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> 的含量	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.2
相对发射强度	51.36	68.22	83.35	100	79.53	64.68	54.86

#### 2.5 CaMgSi<sub>x</sub>O<sub>2x+2</sub>: Eu<sup>3+</sup>的发光性能

 $CaMgSi_xO_{2x+2}$ : Eu<sup>3+</sup>激发光谱如图 4(a) 所示,与 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 激发光谱图 2 相比, 在 185 nm 出现了一 个新的峰值, 而峰值位于 217 nm 的电荷迁移吸收带在图中 很不明显,估计是由于杂相CaSiO3存在的影响,其机理还需 进一步实验讨论。

从图 4(b)我们可以发现 CaMgSi<sub>x</sub>O<sub>2x+2</sub>: Eu<sup>3+</sup> 的发射强





$$a: x=1.8; b: x=2.2; c: x=2.4$$

度随着 x 的增大而增大,当 x=2.2 时取得最大值,此后随 着 x 的增大而减小。在合成无机的荧光粉材料时过量的 SiO<sub>2</sub> 是为了使固相反应进行得更完全,避免在最后的合成产物中 生成过多杂相 CaSiO<sub>3</sub>。杂相的减少,使得 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> 中的 Eu<sup>3+</sup>的激活作用加强<sup>[8]</sup>。对于激活剂 Eu<sup>3+</sup>来说, CaSiO<sub>3</sub> 的 存在相当于另一种基质,会降低其在基质 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> 中的 作用。但是如果 SiO<sub>2</sub> 的量继续增加,荧光粉的发射强度反而 会下降,这是由于在最后的样品中存在了大量未反应的 SiO<sub>2</sub>。因此,确定 SiO<sub>2</sub> 的合理含量是很重要的。

#### 2.6 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup> 真空紫外光谱

如图 5 所示为 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>2+</sup> 真空紫外发射光谱。样 品 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>2+</sup>在 172 nm 真空紫外光激发下的发射光 谱。由图可见,样品呈蓝色发射,发射主峰位于 452 nm,是 Eu<sup>2+</sup>的 5 $d \rightarrow 4f$  跃迁的典型发射。由上,Eu<sup>2+</sup>激活的 CaMg-Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> 荧光粉在真空紫外波段(<200 nm)有较强吸收,适合 做 PDP 蓝色荧光粉。

Eu 是重要的低价稀土离子,基态能级为  $4f^7$  ( ${}^8S_{7/2}$ ),有 7 个电子,最低激发态可能由  $4f^7$  能级形成,也可能是  $4f^65d$  能级。如果不考虑 6 个电子的相互作用, 4f<sup>6</sup>5d 中的 5d 轨道 在立方场中将分裂为E<sub>g</sub>和 T<sub>2g</sub>, 如果 4f<sup>6</sup>电子与 5d 相互作用 较强时,能级混杂程度加强, 会给出许多吸收或激发的谱 带; 如果相互作用减弱, 光谱带减少<sup>[9,10]</sup>(见图 6)。



Fig. 5 VUV emission spectrum of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>2+</sup>



# 3 结 论

(1)样品 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu 晶体结构为单斜晶系的硅酸钙 镁石结构,基质掺入激活离子后结构没有明显变化。

(2)CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup>可见光发射(611 nm)的 VUV 激 发谱包括一个位于在 120~190 nm 宽谱带和分散在 200~ 230 nm 光谱区域峰值位于 130, 168 和 217 nm 左右的谱带, 分别对应基质吸收带和电荷迁移吸收带。CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 的发射谱中包括峰值位于 596, 611, 655 和 700 nm 四个发射 带,它们分别对应于 Eu<sup>3+</sup>的<sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>1</sub>, <sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub>, <sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>3</sub> 和<sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>4</sub> 跃迁发射(其中峰值位于 611 nm 的发射峰最强, 说明 Eu<sup>3+</sup>占据了非反演对称中心)。

(3)在高温固相反应中, $H_3BO_3$ 助熔剂的加入更好地促进激活剂进入晶体形成发光中心从而提高发光材料 CaMg-Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>:Eu<sup>3+</sup>的发光强度。

(4)适当调整 CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>3+</sup> 中 SiO<sub>2</sub> 的相对含量,可 以提高其发光强度。

(5)CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>: Eu<sup>2+</sup>在 172 nm 真空紫外光激发下呈蓝 色发射,发射主峰位于 452 nm,是 Eu<sup>2+</sup>的 5 $d \rightarrow 4f$  跃迁的典 型发射。

#### 参考文献

- [1] Okazaki C, Shiiki M, Suzuki T, et al. J. Lumin., 2000, 87-89: 1280.
- [2] Ling J, Cheng Kang C, Da Li M. Journal of Alloys and Compounds, 2003, 360: 193.
- [3] Daud A, Kunimoto T, Yoshimatsu R, et al. ICSE2000 Proceedings, Nov., 2000.
- [4] You H P, Wu X Y, Zeng X Q, et al. Materials Science and Engineering, 2001, B86:11.
- [5] Belsky A N, Krupa J C. Displays, 1999, 19: 185.
- [6] Blasse G, Grabmaier B C. Luminescence Materials. New York: Springer-Verlag, 1994, 22.
- [7] Shionoya S, et al. Phosphor Handbook. Boca Raton: CRC Press, 1999, 190.
- [8] Kim Y I, Nahm S H, Im W B. J. Lumin, 2005, 115: 1.
- [9] QIAO Bin, ZHANG Zhong-tai TANG Zi-long, et al(乔 彬,张中太,唐子龙,等). Journal of Chinese Rare Earth Society(中国稀土学报), 2003, 21: 192.
- [10] DING Shi-jin, ZHANG Wei, XU Bao-qing, et al(丁士进,张卫,徐宝庆,等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析), 2001, 21(3): 275.

# **VUV Spectral Properties of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu**

#### ZHOU Dan, HE Da-wei\*, HOU Tao

Key Laboratory of Luminescence and Optical Information, Ministry of Education and Institute of Optoelectronic Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China

Abstract CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu samples were synthesized by a normal solid state reaction using CaCO<sub>3</sub> , MgO, SiO<sub>2</sub> and Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as starting materials. The properties of structure, VUV excitation and luminescence under VUV excitation were studied. CaMg-Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu belongs to the monoclinic space group, and the crystal structure does not change as the crystal lattice is doped with Eu ions. The emission spectra of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>3+</sup> have revealed an intense and sharp (611 nm) red color emission from Eu<sup>3+</sup> (<sup>5</sup>D<sub>0</sub>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub>) transition under 147 nm VUV excitation. The correlative data shows that the concentration quenching occurs when the Eu<sup>3+</sup> mole concentration ranges from 0.02 to 0.10 mol. The emission spectra of CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu<sup>2+</sup> have revealed an intense and sharp (452 nm) blue color emission from Eu<sup>2+</sup> (5*d*→4*f*) transition under 172 nm VUV excitation. It can be seen that the intensity of the emission peak increases with increasing H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> concentration.

Keywords CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> : Eu; Plasma display panel; Vacuum ultraviolet

(Received Jan. 23, 2006; accepted May 8, 2006)

\* Corresponding author